



34. Workshop

Testmethoden und Zuverlässigkeit von Schaltungen und Systemen

27.02. - 01.03.2022, Bremerhaven

Call for Papers

Programmkomitee

J. Alt
Infineon Technologies AG

W. Anheier
Universität Bremen

B. Becker
Universität Freiburg

R. Drechsler
Universität Bremen und DFKI GmbH

S. Eggersglüß
Siemens Digital Industries Software

P. Engelke
Infineon Technologies AG

G. Fey
Technische Universität Hamburg

A.-P. Fonseca-Müller
Bosch Sensortec GmbH

M. Gössel
Universität Potsdam

S. Hellebrand
Universität Paderborn

K. Hofmann
Technische Universität Darmstadt

S. Holst
Kyushu Institute of Technology

W. Hoppe
Rheinmetall AG

F. Hopsch
Fraunhofer IIS EAS Dresden

S. Huhn
Universität Bremen und DFKI GmbH

R. Krenz-Baath
Hochschule Hamm-Lippstadt

M. Krstic
Universität Potsdam und IHP GmbH

V. Petrovic
Robert Bosch GmbH

I. Polian
Universität Stuttgart

F. Pöhl
Apple Inc.

S. Sattler
Universität Erlangen-Nürnberg

M. Sauer
Advantest Europe GmbH

M. Schillinsky
NXP Semiconductors Germany GmbH

J. Schlöffel
Siemens Digital Industries Software

H. Schmidt
IBM Deutschland GmbH

M. Schölzel
Hochschule Nordhausen

J. Sepulveda
Airbus Defence and Space

M. Tahoori
Karlsruhe Institut für Technologie (KIT)

D. Tille
Infineon Technologies AG

M. Wahl
Universität Siegen

H.-J. Wunderlich
Universität Stuttgart

Der Workshop „Testmethoden und Zuverlässigkeit von Schaltungen und Systemen“ ist das bedeutendste deutschsprachige Forum, um Trends, Ergebnisse und aktuelle Probleme auf dem Gebiet des Tests, der Diagnose und der Zuverlässigkeit digitaler, analoger, Mixed-Signal- und HF-Schaltungen sowie Systemen zu diskutieren. Der Austausch von Ideen ist ein wichtiges Anliegen des Workshops. Erwünscht sind sowohl Beiträge aus der industriellen Praxis als auch von Forschungseinrichtungen. Wir begrüßen stark praxisbezogene Erfahrungsberichte und Ergebnisse ebenso wie Beiträge zu theoretischen Themen.

Beiträge zu folgenden und weiteren Themen werden erbeten:

- Adaptive Systeme (z.B. Selbstreparatur, self-healing, self-awareness)
- Automatisches Test-Equipment, Testautomatisierung, Testprogramme und Testmodellierung
- Defekt- und Fehlermodellierung
- Diagnose von Ausfallursachen
- Fehlertoleranz, Resilienz, Robuste und strahlenresistente Systeme
- Funktionale Sicherheit
- Hardware-orientierter Test und Hardware-orientierte Sicherheit
- Statistische und maschinelle Lernverfahren für Test und Zuverlässigkeit
- Systemtest und -zuverlässigkeit
- Test und Simulation von Mixed-Signal, HF- und Analog-Schaltungen
- Testerzeugung, Fehlersimulation, Selbsttest und Online-Test
- Testgerechter Entwurf, DFT Methodik
- Testkosten und Qualität
- Teststandards, z.B. IEEE 1149.x, IEEE 1687.x, IEEE P1838

Der Workshop findet im **ATLANTIC Hotel Sail City Bremerhaven** statt und wird von der Universität Bremen und der Technischen Universität Hamburg-Harburg organisiert. Interessenten werden gebeten, die Zusammenfassung ihres Beitrags im Umfang von maximal 2 Seiten über die Workshop-Homepage einzureichen. Der Beitrag sollte den Zweck der Arbeit, den Neuigkeitsgehalt und Aspekte der Anwendung beschreiben. Angenommene Beiträge werden auf Wunsch in den informellen Workshop-Handout aufgenommen. Hierzu kann der Beitrag auf 4 Seiten erweitert werden.

Um einen freien Austausch von Ideen und Informationen zu erleichtern, sind während des Workshops Video- und Audioaufzeichnungen nicht gestattet. Die Beiträge und Vorträge auf dem Workshop sind sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache willkommen. Das organisatorische Rahmenprogramm findet auf Englisch statt.

Workshop-Homepage: <http://www.tuz-workshop.de>

Einreichung der Beiträge:

max. 2 Seiten bis spätestens **19. November 2021** über die Workshop-Homepage

Veranstalter

GI FA 3.5 / GMM FA 6.5 / ITG FA 8.2



GMM

ITG

RSS Kooperationsgemeinschaft Rechnergestützter Schaltungs- und Systementwurf

Tagungsleitung

Dr.-Ing. Sebastian Huhn
Senior Researcher
Universität Bremen
Bibliothekstraße 5
28359 Bremen
E-Mail: huhn@uni-bremen.de

Wissenschaftliche Tagungsleitung

Prof. Dr.-Ing. Görschwin Fey
Professor für Technische Informatik
Technische Universität Hamburg
Am Schwarzenberg-Campus 3 (E)
21073 Hamburg
E-Mail: goerschwin.fey@tuhh.de